

Bereich: C&P Tech Dresden
 Akkreditierungsnummer: D-PL-14415-02-10
 Verantwortlichkeit: QMB
 Stand: 03.04.2024

Norm / SOP : Ausgabestand	Titel
BIA 7487:2003-10	Verfahren zur analytischen Bestimmung geringer Massen gehalte von Asbestfasern in Pulvern, Pudern und Stäuben mit REM/EDX
BGI/GUV-I 505-46:2014-02	Verfahren zur getrennten Bestimmung der Konzentrationen von lungengängigen anorganischen Fasern in Arbeitsbereichen - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren (ab Kapitel 2 Abschnitt 2.3)
VDI 3492:2013-06	Messen von Innenraumluftverunreinigungen - Messen von Immissionen - Messen anorganischer faserförmiger Partikeln - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
VDI 3861 Blatt 2:2023-05	Messen von Emissionen - Messen anorganischer faserförmiger Partikel im strömenden Reingas - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren (nur Analytik)
VDI 3866 Blatt 1:2021-12	Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Grundlagen - Entnahme und Aufbereitung der Proben
VDI 3866 Blatt 5:2017-06	Bestimmung von Asbest in technischen Produkten - Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren
VDI 3877 Blatt 1:2011-09	Messen von Innenraumverunreinigungen - Messen von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben - Probennahme und Analyse (REM/EDXA)
SOP M 935:2016-12	Untersuchung von künstlichen Mineralfasern (KMF) zur Einstufung gemäß TRGS 905
SOP M 2903:2016-12	Untersuchung von Kontaktproben auf Asbest mittels Rasterelektronenmikroskopie mit energiedispersiver Röntgenmikroanalyse
DIN EN ISO 6507-1:2024-01	Härteprüfung nach Vickers - Teil 1: Prüfverfahren
DIN EN ISO 643:2020-06	Stahl – Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren Korngröße
DIN EN ISO 1463:2021-08	Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches Verfahren
DIN EN 13925-2:2003-07	Zerstörungsfreie Prüfung - Röntgendiffraktometrie von polykristallinen und amorphen Materialien - Teil 2: Verfahrensabläufe
SOP M 363:2021-03	XRD-Verfahren qualitativ
SOP M 446:2021-03	Abbildung von Probenoberflächen und Schliffen mit Sekundär- und Rückstreuelektronen und Analyse mittels REM/EDX bzw. ESEM/EDX (DD)
SOP M 502:2021-03	Allgemeines Messverfahren der Rasterelektronenmikroskopie (REM/ESEM) und energiedispersiven Röntgenmikroanalyse (EDX) (DD)
SOP M 1179:2008-11	Dotandenprofilmessungen an Halbleitermaterialien mittels Spreading Resistance Profiling (SRP)
SOP M 1183:2017-10	Dotandenprofilmessungen in Halbleitermaterialien mittels Sekundärionenmassenspektrometrie (SIMS)
SOP M 1177:2021-03	Oberflächen-, dünnschicht- und mikroanalytische Untersuchungen von Werkstoffen mittels Photoelektronenspektrometrie (XPS X-ray Photoelectron Spectrometry)
DIN EN ISO 11357-1:2023-06*	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 1: Allgemeine Grundlagen

Bereich: C&P Tech Dresden
Akkreditierungsnummer: D-PL-14415-02-10
Verantwortlichkeit: QMB
Stand: 03.04.2024

Norm / SOP : Ausgabestand	Titel
DIN EN ISO 11357-2:2020-08*	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur und der Glasübergangsstufenhöhe
DIN EN ISO 11357-3:2018-07*	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie
DIN EN ISO 11357-6:2018-07 *	Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: Bestimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und Oxidations-Induktionstemperatur (dynamische OIT)
DIN EN ISO 11358-1:2022-07*	Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren: Allgemeine Grundsätze
SOP M 455:2021-03	Prüfungen an Halbleiterprodukten mittels Rasterelektronenmikroskopie: Abbildung und Analyse von Probenoberflächen/Schliffen mittels REM/EDX (BLZ)

* Freie Auswahl genormter oder gleichzusetzender Prüfverfahren. Analyse gemäß verschiedenster Vorschriften (z.B. Automotive) möglich.

Business Line: C&P Tech Dresden
 Accreditation number: D-PL-14415-02-10
 Responsibility: QMB
 Revision: 03 April 2024

Standard / SOP : Revision	Title
BIA 7487:2003-10	Method for analytical determination of low mass contents of asbestos fibres in powders and dusts with REM/EDX
BGI/GUV-I 505-46:2014-02	Method for separate determination of concentrations of respirable inorganic fibres in work areas - Scanning electron microscopy method (from chapter 2, section 2.3)
VDI 3492:2013-06	Indoor air measurement - Ambient air measurement - Measurement of inorganic fibrous particles - Scanning electron microscopy method
VDI 3861 Blatt 2:2023-05	Stationary source emissions - Measurement of inorganic fibrous particles in exhaust gas - Scanning electron microscopy method (analysis only)
VDI 3866 Blatt 1:2021-12	Determination of asbestos in technical products - Principle - Sampling and sample preparation
VDI 3866 Blatt 5:2017-06	Determination of asbestos in technical products - Scanning electron microscopy method
VDI 3877 Blatt 1:2011-09	Indoor air pollution - Measurement of fibrous dust settled on surfaces - Sampling and analysis (REM/EDXA)
SOP M 935:2016-12	Analysis of artificial mineral fibres (AMF) for classification in accordance with TRGS 905
SOP M 2903:2016-12	Analysis of contact samples for asbestos using scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray microanalysis
DIN EN ISO 6507-1:2024-01	Vickers hardness test - Part 1: Test method
DIN EN ISO 643:2020-06	Steels - Micrographic determination of the apparent grain size
DIN EN ISO 1463:2021-08	Metallic and oxide coatings - Measurement of coating thickness - Microscopical method
DIN EN 13925-2:2003-07	Non-destructive testing - X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous material - Part 2: Procedures
SOP M 363:2021-03	XRD method qualitative
SOP M 446:2021-03	Imaging of sample surfaces and sections with secondary and backscattered electrons and analysis using SEM/EDX or ESEM/EDX
SOP M 502:2021-03	General measuring procedure of scanning electron microscopy (SEM/ESEM) and energy dispersive X-ray microanalysis (EDX)
SOP M 1179:2008-11	Dotand profile measurements of semiconductor materials using spreading resistance profiling (SRP)
SOP M 1183:2017-10	Dotand profile measurements of semiconductor materials using secondary ion mass spectrometry (SIMS)
SOP M 1177:2021-03	Surface, thin-film and microanalytical analysis of materials using photoelectron spectrometry (XPS X-ray photoelectron spectrometry)
DIN EN ISO 11357-1:2023-06*	Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: Noise control strategies
DIN EN ISO 11357-2:2020-08*	Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 2: Determination of glass transition temperature and glass transition step height

Business Line: C&P Tech Dresden
 Accreditation number: D-PL-14415-02-10
 Responsibility: QMB
 Revision: 03 April 2024

Standard / SOP : Revision	Title
DIN EN ISO 11357-3:2018-07*	Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of the melting and crystallisation temperature and enthalpy of melting and crystallisation
DIN EN ISO 11357-6:2018-07 *	Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)
DIN EN ISO 11358-1:2022-07*	Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers: General principles
SOP M 455:2021-03	Imaging and analysis of sample surfaces/sections using SEM/EDX

* Free choice of standard test methods or equivalent methods. Analysis in accordance with various regulations (e.g. automotive) possible.